专题: 低维材料非线性光学与器件

$GeSe_2$ 中强各向异性偏振相关的非线性光学响应^{*}

欧阳昊1)2)3)# 胡思扬1)# 申曼玲1)2)3) 张晨希1) 程湘爱1)2)3) 江天2)†

1) (国防科技大学前沿交叉学科学院,长沙 410073)

2) (脉冲功率激光技术国家重点实验室, 长沙 410073)

3) (高能激光技术湖南省重点实验室,长沙 410073)

(2020年3月25日收到; 2020年4月11日收到修改稿)

二硒化锗 (GeSe₂) 作为一种层状 IV-VI 族半导体,具有面内各向异性结构及宽能带间隙,表现出了独特的光、电及热学性能.本文利用偏振拉曼光谱和线性吸收谱分别对 GeSe₂ 纳米片的晶轴取向和能带特性进行表征,并以此为依据采用微区 I 扫描系统研究了 GeSe₂ 在共振能带附近的光学非线性吸收机制.结果表明,GeSe₂ 中非线性吸收机制为饱和吸收与激发态吸收的叠加,且对入射光偏振与波长均有强烈的依赖.近共振激发 (450 nm)条件下,激发态吸收对偏振的依赖程度比较大,随着入射光偏振的不同,非线性调制深度可由 4.6% 变化至 9.9%;而非共振激发 (400 nm)时,该调制深度仅由 7.0% 变化至 9.7%.同时,相比于饱和吸收,激发态吸收的偏振依赖程度受远离共振激发波长的影响而变化更大.

关键词: 各向异性,激发态吸收,微区 I 扫描 PACS: 42.65.-k, 42.70.Nq

DOI: 10.7498/aps.69.20200443

1 引 言

自 2004 年石墨烯成功问世以来^[1],以石墨烯 为代表的众多二维材料,例如过渡金属硫族化合 物^[2-7]、拓扑绝缘体^[8-12]、黑磷^[13-15]等,获得了研 究者们的大量关注^[16-18].其中,黑磷因其超高的电 子迁移率及层厚相关的能带特性,成为近年来研究 的热点材料之一.具体而言,10 nm 厚的黑磷迁移 率可达 10³ cm²·V⁻¹·s⁻¹,其带隙可由体材料的 0.3 eV 增加至单层的 2.0 eV^[19].除此之外,黑磷独特的面 内各向异性结构也使得它有着与众不同的各向异 性的光学、电学响应^[13,20,21]. 然而, 黑磷在空气中的不稳定性及易挥发性, 使其难以进一步被广泛利用.因此, 亟需找到与黑磷性质相似且稳定的二维材料.

目前, 研究者们主要将目光聚焦于以下两类材料. 第一类为黑磷的等电子体, IV-VI 族 MX (其中M = Ge, Sn; X = S, Se)型化合物, 如 GeS^[22,23]和 SnSe^[24]等. 第二类是极少部分特殊的过渡金属硫族化合物, 如 ReS₂和 ReSe₂等. 它们的光学^[22,25]、振动^[26]、热学^[27,28]和电子传输^[29,30]特性均具有强各向异性的特点, 使其在传感器和电子设备中都具有广阔的应用前景. 但是这两类材料的禁带较窄(<2 eV),导致工作波段受限. 因此, 非常有必要探索宽禁带的各向异性二维材料.

^{*} 国家自然科学基金 (批准号: 11802339, 11805276, 61805282, 61801498, 11804387, 11902358)、国防科技大学科学研究基金 (批准号: 2K16-03-59, ZK18-01-03, ZK18-03-36, ZK18-03-22)、湖南省国家科学基金 (批准号: 2016JJ1021)、脉冲功率激光技术国家 重点实验室开放董事基金 (批准号: SKL2018ZR05)、湖南省高能技术重点实验室开放研究基金 (批准号: GNJGJS03)、激光与物 质相互作用国家重点实验室开放基金 (批准号: SKLLIM1702) 和青年人才培养项目 (批准号: 17-JCJQ-QT-004) 资助的课题.

[#] 同等贡献作者.

[†] 通信作者. E-mail: tjiang@nudt.edu.cn

^{© 2020} 中国物理学会 Chinese Physical Society

近年来兴起的各向异性半导体 GeSe2, 由于其 具有宽禁带的优势,获得了众多学者的广泛关注[31]. 华中科技大学翟天佑团队[32] 通过化学气相沉积法 成功制备了 7 nm (约 10 层)的 GeSe₂ 纳米片,并 基于该材料的大吸收系数实现了具有高响应度和 快速响应的 GeSe2 的光电探测器. 中国科学院化学 研究所的胡劲松团队^[33]通过机械剥离法得到了 3.5 nm (6 层) 的 β相 GeSe₂, 其在短波区域表现出 高度偏振相关的光电响应,并且在空气环境中有较 好的稳定性. 作为一种典型的 IV-VI 族化合物, 相 比于 α 相和 γ 相, β 相的 GeSe, 是最稳定的. 该相 的 GeSe2 体态带隙为 2.7 eV, 而单层带隙可以达 到3 eV. 在光学特性方面, GeSe2的吸收系数可达 10⁴ cm⁻¹, 光电探测器的开关比可超过 10^{2[34]}; 在电 学特性方面,掺杂后的 GeSe, 空穴迁移率可以达 到 690 cm²·V⁻¹·s^{-1[35]}, 光电响应度可达 2.5 A·W⁻¹, 且上升沿与下降沿响应时间为 0.2 s^[32]. 上述表明 了 GeSe2 有着优良的线性光学和电学特性, 但截至 目前,该材料的光学非线性特性暂未发现有团队报 道过. 而宽带隙各向异性半导体材料一般有着较优 良的非线性光学响应[24]. 基于此, 本文的工作主要 围绕 GeSe₂的非线性光学效应展开.

本文对 GeSe2 纳米片在近共振吸收峰附近的 非线性光学吸收特性进行了研究. 首先通过偏振选 择的拉曼光谱表征 GeSe₂ 纳米片晶轴取向,并利用 偏振选择的线性吸收谱对其各向异性能带进行表 征,得到其共振波长在 450 nm (2.72 eV) 附近.进 一步,为了研究 GeSe₂纳米片在共振能带附近的非 线性吸收模式,本文使用偏振可调的微区 I 扫描系 统对其进行测试.结果表明, GeSe, 中非线性吸收 模式为饱和吸收与激发态吸收的叠加吸收状态,且 对入射光偏振与波长均有强烈的依赖,尤其是激发 态吸收. 在 450 nm 近共振激发时, 随着入射光偏 振的不同,非线性吸收调制深度可由 4.6% 变化至 9.9%, 其动态调制深度 (不同偏振激发下的调制深 度差)为 5.3%; 而在 400 nm 非共振激发时, 调制 深度由 7.0% 变化至 9.7%, 动态调制深度仅 2.7%. 其中,相比于饱和吸收,激发态吸收模式的偏振依 赖程度对波长更为敏感,这是动态调制深度对波长 有较大依赖的主要原因.本文为 GeSe₂ 纳米片各向 异性非线性光学特性的应用打下了理论基础,为全 光开关的实现提供了一种偏振调控的方案.

2 实验方法

采用机械剥离的方法制备 GeSe₂ 纳米片样品, 并使用原子力显微镜 (atomic force microscope, AFM) 对其厚度和粗糙度进行表征.为确定 GeSe₂ 薄片的晶轴取向,使用 532 nm 的低功率连续激光 测量其偏振相关拉曼光谱.使用商用微型光谱仪 (Micro, ideaoptics, China) 对不同入射偏振下样 品的反射谱 (R) 和透射谱 (T) 进行测试,其中控 制灯箱在低峰值功率工作,避免非线性光学效应, 并通过A = 1 - R - T计算得到样品的偏振相关线 性吸收谱.两光谱测试过程中,偏振均以 15°为步 长旋转,共旋转 180°.

光学非线性吸收实验采用的是偏振可调节的 微区 I 扫描系统.其中,由钛宝石激光器 (Spectra-Physics, 35 fs, 800 nm, 1 kHz) 输出的飞秒激光经 过光学参量放大器 (TOPAS) 转换到实验所需波 长 (400 nm & 450 nm, 1 kHz),并通过中性密度滤 光片 (Thorlabs, NDL-10C-4) 连续改变光强,实现 I 扫描. 入射激光的偏振方向由半波片和格兰棱镜 组合进行调节,以 15°为步长旋转 180°.激光由共 焦显微镜 (徕卡 DM 2700M) 以及宽范围波长物镜 (Mitutoyo 50×, NA = 0.65, 400—1700 nm) 在样 品表面聚焦为直径 2 µm 的光斑.在信号检测方面, 使用斩波器 (Thorlabs, MC2000 B-EC) 将光的重 复频率调制到 500 Hz,与双通道锁相放大器 (Sine Scientific Instrument, OE1022D) 组合,降低测试 噪声.

3 结果与讨论

3.1 GeSe₂ 的制备和表征

图 1(b) 为 GeSe₂ 薄片的 AFM 图. 可以看出, 样品厚度为 88 nm, 表面平整, 符合实验要求. 样 品偏振相关的拉曼光谱如图 1(c) 所示, 在波数为 118, 212, 251 和 307 cm⁻¹ 处分别有 4 个拉曼峰, 对应着 β -GeSe₂ 的典型 A_g 振动模式^[19,32]. 为了定 量研究拉曼强度的偏振相关性, 将四种典型拉曼模 式的强度绘成极坐标图, 并且引入经典 Placzek 模 型对结果进行拟合和解释. 拉曼强度可以表示为 $I \propto |e_i \cdot \tilde{R} \cdot e_s^T|$, 其中 $e_i \approx e_s^T$ 分别表示入射光和散 射光的单位电极化矢量, \tilde{R} 是拉曼张量. 在本实验



图 1 (a) GeSe₂ 原子结构示意图; (b) 机械剥离 GeSe₂ 纳米片的 AFM 图, 样品的厚度为 88 nm; (c) 偏振选择的拉曼光谱, 其中 4 个拉曼峰位置分别在 118, 212, 251, 307 cm⁻¹; (d)—(g) 4 个拉曼峰强度分别对应的极坐标示意图

Fig. 1. (a) Schematic diagram of the atomic structure of $GeSe_2$; (b) AFM image of $GeSe_2$ flake by mechanical exfoliation. The thickness of the sample is 88 nm; (c) polarization-dependent Raman spectrum. Four Raman peak positions are at 118, 212, 251, 307 cm⁻¹, respectively; (d)–(g) polar diagrams of the intensity of the four Raman peaks.

条件中, $e_i 和 e_s d = a - b = m$, 对于与 a = b = n, 对于与 a = b = n为 θ 的入射光, 矢量 $e_i = n$ 表示为 $(0, \cos\theta, \sin\theta)$. 在 平行收集条件下, 散射光方向 $e_s = n$ 样表示为 $(0, \cos\theta, \sin\theta)$. A_g模式的拉曼张量由下式给出:

$$\tilde{\boldsymbol{R}}_{A_{g}} = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}.$$
 (1)

因此, Ag模式强度随θ的变化可表示为^[24]

 $I_{A_g}^{//} \propto \left(|b| \cos^2\theta + |c| \cos \varphi_{bc} \sin^2\theta \right)^2 + |c|^2 \sin^2\varphi_{bc} \sin^4\theta,$ (2)

其中,吸收样品的拉曼张量元 a, b, c均为复数; φ_{bc} 为 b和 c之间的相位差 $\varphi_{b} - \varphi_{c}$.利用 (2)式对 A_{g} 模式的偏振相关拉曼峰值强度进行拟合,结果 如图 1(d)—(g)中红色曲线所示,并确定了 GeSe₂ 样品的 a轴和 b轴方向,用蓝色箭头进行了标记.

3.2 偏振相关线性吸收谱表征 $GeSe_2$ 的能带

线性吸收谱可用于表征二维材料在不同光谱 区域吸收光子的能力分布,从而间接推断出材料的 能级位置,为光学非线性吸收测试的波长选择提供 参考依据.GeSe₂纳米片的线性吸收谱如图 2(a) 所示.总体而言,样品对各偏振方向的激光,线性 吸收率均由 360 nm 波长位置处的 40%—50% 先 下降至 420 nm 处的约 5%, 而后呈现上升趋势; 对于不同偏振方向的激光, 线性吸收率在波长小于 380 nm 和波长大于 410 nm 的区域相差较大, 而在 400 nm 处差异最小.

为了对能隙进行定量表征,接下来使用陶克模型 (Tauc model) 对不同偏振激发下样品的线性吸收谱进行拟合,

$$\alpha h\nu = A \cdot \left(h\nu - E_{\rm g}\right)^{1/2},\tag{3}$$

式中, α为线性吸收系数, A 为矩阵元相关常数, Eg 为材料的带隙. 0°与 90°偏振的拟合结果如图 2(b) 和图 2(c) 所示, 能隙分别为 2.717 eV 与 2.729 eV. 将所有偏振方向的能隙结果 Eg(θ) 绘制在极坐标 中,可以更直观地看到纺锤形的偏振相关带隙 分布, 如图 2(d) 所示, 其中光学带隙最大的位置 出现在 120°偏振方向 (样品的 b 轴方向), 其数值 为 2.732 eV (453 nm); 光学带隙最小的位置是在 30°偏振方向 (样品的 a 轴方向), 其值为 2.711 eV (457 nm), 与文献报道相近^[32,34].

如前所述,波长 400 nm (非共振区域)附近, 样品对不同偏振激光的线性吸收率差异最小 (约 4%),而在 450 nm (近共振区域)处差别较大 (约 10%),如图 2(e) 和图 2(f)所示.一般来说,非线性 吸收的偏振依赖性与线性吸收谱的各向异性密切



图 2 线性吸收谱对层状 GeSe₂ 的各向异性能带表征 (a) 0°—180°偏振方向的线性吸收谱,其中间隔 15°; (b) 0°偏振方向的能带 确定;由陶克定理间接得到的能带位置,其中切线与横坐标交点位置为 2.717 eV; (c) 90°偏振方向的能带确定;由陶克定理间接得到的能带位置,其中切线与横坐标交点位置为 2.7291 eV; (d) 层状 GeSe₂ 的各向异性能带; b 轴方向上的带隙最大,而 a 轴方向的带隙 最小; (e) 层状 GeSe₂ 在 400 nm 处的各向异性线性吸收率极坐标图; (f) 层状 GeSe₂ 在 450 nm 处的各向异性线性吸收率极坐标图 Fig. 2. Characterization of anisotropic bands of layered GeSe₂ by linear absorption spectrum: (a) Linear absorption spectrum with polarization directions from 0° to 180° with intervals of 15°; (b) the energy band of the 0° polarization direction is determined. The band position obtained indirectly from Tauc's theorem, where the position of the intersection of the tangent and the abscissa is 2.717 eV; (c) determination of the energy band of the 90° polarization direction. The band position obtained indirectly from Tauc's theorem, where the abscissa is 2.7291 eV; (d) anisotropic energy bands of layered GeSe₂. The band gap in the *b*-axis direction is the largest, and the band gap in the *a*-axis direction is the smallest; (e) polar graph of anisotropic linear absorption of layered GeSe₂ at 450 nm.

相关^[24], 故选用 400 和 450 nm 波长的激光, 研究 GeSe, 纳米片的偏振相关光学非线性吸收特性.

下面进一步分析层状 GeSe₂的线性吸收依赖 于入射光偏振的原因.基于费米黄金定则,跃迁速 率为单位时间内由初态 *i*跃迁到终态 *f*的概率^[24]:

$$\Gamma_{i \to f} = \frac{2\pi}{\hbar} |\langle f | H_{\rm op} | i \rangle|^2 \rho_f, \qquad (4)$$

其中, ρ_f 为终态的态密度; H_{op} 是光-电微扰项; $\langle f | H_{op} | i \rangle$ 是由微扰导致的终态与初态间的跃迁矩 阵元,其正比关系如下:

$$\langle f | H_{\rm op} | i \rangle \propto \boldsymbol{P} \cdot \boldsymbol{D}_{fi}.$$
 (5)

这里, P 是人射光的偏振矢量; D_{fi} 是偶极子矢量, $D_{fi} = \langle f | \nabla | i \rangle$.则线性吸收强度可以用吸收系数 α 来表征^[36]:

$$\alpha \left(E_{\rm L} \right) \propto \sum_{f,i} \left| \left\langle f \left| H_{\rm op} \right| i \right\rangle \right|^2 \delta \left(E_f - E_i - E_{\rm L} \right), \quad (6)$$

其中, E_L 是入射光子的能量, $E_i(E_f)$ 是电子态 i(f)

的能量.根据跃迁选择定则可知,不同偏振方向的 激光会激发不同能带间的跃迁,即不同的初态 *i* 与 终态 *f*^[37].而从(5)式和(6)式可以看出,随着入射 光的偏振方向改变,偏振矢量 *P*和偶极矢量 *D*_{fi}的 内积也发生变化,进而影响跃迁矩阵元,从而得到 不同的偏振相关的吸收系数 α,进一步推出光学带 隙也具有偏振依赖性.

3.3 GeSe₂中的各向异性非线性光学响应

接下来利用 I 扫描技术对 GeSe₂ 的偏振相关的非线性光学吸收特性进行详细研究. 非线性光学特性的常用研究手段包括 Z 扫描技术和 I 扫描技术^[3,38,39],前者通过样品在光轴方向的位移 Z 改变光斑半径大小,从而获得连续变化的光功率密度^[40],而后者则是通过 1/2 波片加格兰棱镜或者衰减片,直接改变入射激光的光功率达到相同效果^[10].由于 Z 扫描技术中光斑大小随样品移动而不断变化,

对于大多数机械剥离的样品而言,光斑极可能超出 样品区域,无法保证测试的准确性.本文将传统的 I扫描系统改进为微区I扫描系统,提高了信噪比 的同时将光斑大小控制在5μm以内,适用于机械 剥离样品的测试.

首先用 400 nm 飞秒激光入射 GeSe₂ 样品,激 光偏振以 15°为步长旋转 180°,实验结果见图 3(a), 为显示清晰,仅给出间隔 30°的数据外加 90°附近 两个数据.400 nm 激光的光子能量 (3.1 eV)大于 GeSe₂的带隙 (约 2.73 eV),通常呈现饱和吸收特 征,即当高峰值功率激光入射材料时,由于价带电 子不断吸收光子跃迁进入导带,可供激发的电子减 少,导带能态逐渐被占满,材料吸收系数α随光强 的增大而减小,使得材料的透过率 T先增大而后 达到饱和值.但是图 3(a)呈现的反饱和趋势表明, 传统的饱和吸收模型不能很好描述此时的非线性 吸收过程,其中很可能伴有激发态吸收,它是在光 强更强的情况下,由于价带中的电子吸收光子跃迁 至导带后,导带内部的激发态电子进一步吸收光子 继续向上能级跃迁导致的,故会使得材料吸收增加,透过率下降,呈现与饱和吸收相反的趋势.

基于比尔-朗伯定律,光经过一个厚度为 z 的 光学介质后,光强 I 的变化为

$$\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}z} = -\alpha\left(I\right)I,\tag{7}$$

式中, $\alpha(I)$ 为与光强相关的吸收系数, 传统饱和吸收情况下

$$\alpha\left(I\right) = \frac{\alpha_0}{1 + I/I_{\rm s}},\tag{8}$$

其中, α₀为线性吸收系数, *I*_s为饱和吸收光强. 但 是该模型不适用于当前情况, 需额外考虑激发态吸 收项, 则吸收系数表示为^[41]

$$\alpha \left(I \right) = \frac{\alpha_0}{1 + I/I_{1,s}} + \frac{\beta_0 I}{1 + \left(I/I_{2,s} \right)^2}, \tag{9}$$

式中, $I_{1,s}$ 表示线性吸收系数 α_0 的饱和光强, β_0 表 示激发态吸收系数, $I_{2,s}$ 表示激发态吸收的饱和光 强. 利用模型 (7) 式和 (9) 式对 I 扫描的实验结果 进行拟合,可以得到调制深度 $\delta T = T_{max} - T_{min}$



图 3 400 nm 非共振激发下不同偏振方向的叠加态吸收实验结果 (a) I 扫描实验结果,圆圈表示实验数据,实线表示激发态吸收拟合曲线; (b) 偏振相关的非线性调制深度极坐标图; (c) 偏振相关的线性吸收系数 α_0 变化趋势极坐标图; (d) 偏振相关饱和吸收光强 $I_{1,s}$ 极坐标图; (e) 偏振相关的激发态吸收系数 β_0 变化趋势极坐标图; (f) 激发态吸收的偏振相关饱和光强 $I_{2,s}$ 极坐标图

Fig. 3. Experimental results of superposition state absorption of different polarization directions under 400 nm non-resonant excitation: (a) Results of the I-scan experiment. The circles indicate the experimental data, and the solid lines indicate the excited state absorption curve; (b) polarization-dependent non-linear modulation depth polar plot; (c) polar plot of the change in polarizationdependent linear absorption coefficient α_0 ; (d) polarization diagram of polarization-dependent saturated absorption intensity $I_{1,s}$; (e) polarization diagram of the polarization-dependent excited state absorption coefficient β_0 ; (f) polarized graph of polarizationdependent saturation light intensity $I_{2,s}$ absorbed by the excited state.

表 1 400 nm 非共振激发偏振相关的 I 扫描非线性叠加态吸收参数的拟合结果

Table 1. Fitting results of I-scan nonlinear superposition state absorption parameters related to 400 nm non-resonant excitation polarization.

Polarization/(°)	$lpha_0/{ m cm}^{-1}$	$eta_0 / \mathrm{cm} {\cdot} \mathrm{GW}^{-1}$	$I_{ m 1,s}/ m GW{\cdot}cm^{-2}$	$I_{2,\mathrm{s}}/\mathrm{GW}{\cdot}\mathrm{cm}^{-2}$	$\delta T/\%$
0	31559	508	15947	41	7.0
30	33593	559	7962	38	7.5
60	36579	606	972	35	8.2
90	38790	663	349	34	9.7
120	36972	599	1394	36	8.1
150	34029	543	6629	39	7.3
180	31062	496	17082	41	7.0

(表征非线性吸收的整体特性)、线性吸收系数 α₀、 饱和吸收光强 *I*_{1,s}、激发态吸收系数 β₀ 及激发态吸 收的饱和项 *I*_{2,s}. 拟合结果的极坐标分别如图 3(b)— (f) 所示, 部分拟合数据由表 1 列出.

通过对比图 3(b) 与图 2(e) 发现, 调制深度的 极坐标图轴向与线性吸收率的基本符合, 即非线性 吸收整体的偏振依赖特性与线性吸收相似. 入射激 光偏振 90°时, 调制深度最大, 为 9.7%, 0°时最小, 为 7.0%. 通过改变偏振方向, 调制深度的动态可调 范围为 2.7%. 由于 GeSe₂ 的非线性吸收为饱和吸 收与激发态吸收的叠加, 下面进行具体讨论.

饱和吸收对应于 (9) 式中的前项. 线性吸收系 数 α_0 的拟合结果如图 3(c) 所示, 该参数反映出电 子由下能级至上能级跃迁的概率, 0°偏振方向激 发 GeSe₂中的电子由价带跃迁至导带内部的概率 最低, 90°偏振方向概率最高. 饱和吸收光强 $I_{1,s}$ 取 决于两个因素: 从下能级到上能级的跃迁概率以及 上、下能级的态密度^[41], 前者由线性吸收系数 α_0 反 映, 后者为单位能量间隔的可占据状态数, 决定了 下能级可被激发的电子以及上能级可供电子填充 的能态数, 与电子能带结构有关. 跃迁概率越小, 态密度越大, 材料吸收越难饱和, 饱和光强越大. 因此, 饱和吸收光强 $I_{1,s}$ 的偏振依赖特性不仅与线 性吸收系数 α_0 相关, 而且上、下能级受态密度的影 响, 故其极坐标图的纺锤形长轴与 α_0 的短轴恰好 相合, 但偏振依赖程度比之更高.

激发态吸收对应于 (9) 式中的后一项, 激发态 吸收系数 β₀可以反映电子由激发态跃迁至上能级 的概率, 激发态吸收的饱和项 *I*_{2,s}类似于饱和吸收 光强, 由激发态向上能级的跃迁概率以及态密度共 同决定. 如图 3(e) 所示, 激发态吸收系数 β₀ 最小的 偏振方向与α₀是一致的, 即在 400 nm 非共振激发 的情况下,激发态电子向更高能态跃迁与价带电子 向导带跃迁的概率具有相同的偏振依赖特性.对激 发态吸收而言,价带电子跃迁到导带的概率越大将 会导致激发态电子填充的密度越大,使得激发态吸 收更难饱和,而较高的激发态电子跃迁概率会使得 激发态吸收更易于饱和,二者相反的作用减小了激 发态吸收的偏振依赖程度,导致在 400 nm 非共振 激发波段,材料对不同偏振激光的非线性吸收程度 差异较小.

450 nm 近共振激发条件下的非线性响应实验 结果如图 4(a) 所示,可明显看出样品对此波段不 同偏振激光的非线性吸收区别更大. 当峰值功率达 到 50 GW/cm²时,0°偏振光的归一化透过率趋于 定值,非线性吸收出现较为明显的反饱和趋势,与 之不同的是,90°偏振光的归一化透过率继续呈明 显下降的趋势.同样采用拟合公式(7)和(9)对不 同偏振下的实验结果进行拟合,可得调制深度由 0°偏振方向的 4.6% 增长至 90°偏振方向的 9.9%, 动态调制深度可达 5.3%,远高于 400 nm 非共振激 发条件下的 2.7%.

值得注意的是,在450 nm 近共振激发状态下, 线性吸收系数 α₀与激发态吸收系数 β₀ 对偏振的依 赖特性恰好相反,如图 4(c)和图 4(e)所示.以0° 偏振方向非线性吸收为例,该偏振方向的线性吸收 系数 α₀极小,表明此时电子由价带跃迁至导带底 的概率最低,则相应激发态电子密度低,同时该偏 振激光的激发态吸收系数 β₀为极大值,即此时激 发态吸收发生的概率最大,二者均使得该偏振下激 发态吸收更快饱和,它们的共同作用加强了激发态 吸收的偏振依赖程度,导致在450 nm 近共振激发 波段,材料对不同偏振激光的非线性吸收程度差异 很大.450 nm 近共振激发偏振相关的 I 扫描部分 相关参数的拟合结果见表 2, 表中所列拟合参数与 图 4 对应.

对比 400 与 450 nm 的波长处的偏振选择非 线性光学响应, 它们的饱和吸收模式对偏振的依赖 特性是类似的, 最大的区别在于线性吸收系数 α₀ 与激发态吸收系数 β₀ 对偏振的依赖特性是否相同, 二者相反的偏振依赖特性可以放大偏振对激发态 吸收模式的影响, 从而导致了不同波段非线性吸收 曲线偏振依赖程度的明显差异.进一步对非线性吸 收中的饱和吸收与激发态吸收的占比进行讨论.由 于微区 I-扫描在不同波长处 GeSe₂ 实验结果呈现 的都是反饱和趋势,说明了在共振与非共振波长处 激发态吸收都是占据主导地位.但是,激发态吸收 所占的比例随波长与偏振的不同而略微有所区别. 首先,在共振激发与非共振波长的情况下,沿 90° 偏振方向的激发态吸收的占比高于沿 0°偏振方向



图 4 450 nm 近共振激发下不同偏振方向的叠加态吸收实验结果 (a) I 扫描实验结果, 圆圈表示实验数据, 实线表示激发态吸收 拟合曲线; (b) 偏振相关的非线性调制深度极坐标图; (c) 偏振相关的线性吸收系数 α₀ 变化趋势极坐标图; (d) 饱和吸收的偏振相关 饱和光强 *I*_{1.s}极坐标图; (e) 偏振相关的激发态吸收系数 β₀ 变化趋势极坐标图; (f) 激发态吸收的偏振相关饱和光强 *I*_{2.s}极坐标图

Fig. 4. Experimental results of superposition state absorption of different polarization directions under 450 nm non-resonant excitation: (a) Results of the I-scan experiment. The circles indicate the experimental data, and the solid lines indicate the excited state absorption curve: (b) polarization-dependent non-linear modulation depth polar plot: (c) polar plot of the change in polarizationdependent linear absorption coefficient α_0 ; (d) polarization diagram of polarization-dependent saturated absorption intensity $I_{1,s}$; (e) polarization diagram of the polarization-dependent excited state absorption coefficient β_0 ; (f) polarized graph of polarizationdependent saturation light intensity $I_{2,s}$ absorbed by the excited state.

表 2 450 nm 近共振激发偏振相关的 I 扫描非线性叠加态吸收参数的拟合结果

Table 2. Fitting results of I-scan nonlinear superposition state absorption parameters related to 450 nm non-resonant excitation polarization.

Polarization/(°)	$lpha_0/{ m cm}^{-1}$	$\beta_0/\mathrm{cm}{\cdot}\mathrm{GW}^{-1}$	$I_{ m 1,s}/ m GW{\cdot}cm^{-2}$	$I_{2,\mathrm{s}}/\mathrm{GW}{\cdot}\mathrm{cm}^{-2}$	$\delta T/\%$
0	43909	175	9390	63	4.6
30	49631	157	1258	69	5.6
60	60289	65	409	75	7.1
90	67501	22	188	79	9.9
120	57266	81	469	76	6.8
150	48345	158	2333	68	5.0
180	43173	176	10483	62	4.6

激发态吸收的占比,且该占比随着偏振角度的减小 而减小.另外一方面,同样对于90°偏振方向,在近 共振时由价带向导带跃迁的概率较低,此时激发态 更易于发生,故此时激发态吸收的占比将高于非共 振时的占比;同样的趋势也出现在0°偏振方向.值 得注意的是,由于激发吸收在共振条件下与偏振的 相关性更强,因此在90°方向上随波长远离共振区 激发态吸收的占比减小量大于0°方向的占比减小量.

由于 GeSe₂ 材料的光学非线性吸收在不同偏 振下动态调制深度很大, 它将有潜力应用于偏振选 择的非线性吸收型全光开关[42]. 目前, 研究者对全 光开关的研究主要集中于两类: 一类是线性全光开 关,另一类则是非线性全光开关.线性全光开关是 利用光学干涉效应实现的. 而非线性全光开关则是 利用了材料的非线性光学特性实现一束调制光对 另一束被调制光的控制,使得被调制光的状态可被 识别为"开"或"关". 近年来, 随着光计算和光学神 经网络的兴起,全光开关需要以更快地发展速度跟 上时代的步伐. 二维材料在全光开关的应用中, 有 两类主流的非线性光学解决方案,一类是利用光克 尔效应实现的全光开关[43,44],另一类则是偏振选择 的非线性吸收型的全光开关^[24].其中,光克尔效应 型的全光开关一个较为明显的优势是可实现在高 达 18 GHz 的频率下调制高速信号的波长转换. 对 于各向异性材料 GeSe2 而言,则适用于偏振选择的 非线性吸收型的全光开关 (后文简称偏振型全光开 关) 应用. 偏振选择型全光开关则以高达 44% 的调 制深度差而凸显其优势^[24]. 偏振型全光开关是利 用一束不同偏振的调制光激发二维材料, 使之处于 不同的非线性吸收状态,进而改变信号光的透过 率. 由于 GeSe₂ 是一类各向异性强的二维半导体, 且在非线性光学中表现出较好的性能.在应用于全 光开关时,可以分别利用偏振方向沿着 a 轴和 b 轴 的高脉冲功率的调制光对二维材料的非线性吸收 状态进行调制,进而改变信号光的透过率.具体而 言, 根据 GeSe2 的非线性吸收结果, 可以预测一种 偏振全光开关的实现方案,如图 5 所示:利用格兰 棱镜将调制光的偏振方向设置为沿 x轴 (a-轴)入 射 GeSe2, 此时将使得二维材料对信号光的透过率 为"开"的状态;另外,偏振方向设置为沿 y轴 (b-轴) 入射 GeSe, 时, 此时二维材料对信号光的透过 率调制为"关"的状态. 通过该手段, 最后可利用 GeSe₂的各向异性特性来实现偏振型全光开关.

Switching light Signal light Sample Filter Objective *x*-axi6 Gran prism 1/2 λ plate *Mochulatecd light*

图 5 GeSe₂ 偏振型全光开关的原理示意图 Fig. 5. Schematic diagram of GeSe₂ based polarized-dependent all-optical switching.

4 结 论

利用机械剥离的方式得到了 88 nm 厚的各向 异性 GeSe₂纳米片, 通过 AFM 和偏振相关的拉曼 光谱分别对 GeSe,纳米片的层厚、晶格取向进行了 表征. 为摸索非线性测试波长条件, 本文使用偏振 选择的线性吸收谱研究了 GeSe, 的各向异性吸收 能带, 其中 a 轴方向的能带 Eg,a 最小, 为 2.711 eV, 而 b 轴方向的能带 Eg,b 最大,为 2.732 eV. 最后利 用偏振选择的微区 I 扫描实验系统, 分别在 400 和 450 nm 波段对该样品的各向异性非线性吸收 响应进行测试.结果表明,样品的非线性吸收模式 为饱和吸收和激发态吸收的叠加态,动态调制深度 在 450 nm 近共振能带位置处值最大, 达到 5.3%, 400 nm 处仅为 2.7%. 而且, 激发态吸收模式的偏 振选择特性在近共振波长处对偏振较为敏感,因此 可以通过控制不同位置处的激发波长主动调整动 态调制深度. 本工作为 GeSe2 在全光开关的应用上 打下了理论基础.

参考文献

- Novoselov K S, Geim A K, Morozov S V, Jiang D, Zhang Y, Dubonos S V, Grigorieva I V, Firsov A A 2004 Science 306 666
- [2] Jiang T, Liu H, Huang D, Zhang S, Li Y, Gong X, Shen Y R, Liu W T, Wu S 2014 Nat. Nanotechnol. 9 825
- [3] Zhang J, Ouyang H, Zheng X, You J, Chen R, Zhou T, Sui Y, Liu Y, Cheng X, Jiang T 2018 Opt. Lett. 43 243
- [4] Wang R, Ruzicka B A, Kumar N, Bellus M Z, Chiu H Y, Zhao H 2012 *Phys. Rev. B* 86 045406
- [5] Ling W J, Xia T, Dong Z, Liu Q, Lu F P, Wang Y G 2017 Acta Phys. Sin. 66 114207 (in Chinese) [令维军,夏涛,董忠, 刘勍,路飞平,王勇刚 2017 物理学报 66 114207]
- [6] Hu Y, Jiang T, Zhou J, Hao H, Sun H, Ouyang H, Tong M,

Tang Y, Li H, You J, Zheng X, Xu Z, Cheng X 2019 Nano Energy 68 104280

- [7] Tang Y, Zhang Y, Ouyang H, Zhao M, Hao H, Wei K, Li H, Sui Y, You J, Zheng X, Xu Z, Cheng X, Shi L, Jiang T 2020 Laser Photonics Rev. 1900419
- [8] Zhang H J, Liu C X, Qi X L, Dai X, Fang Z, Zhang S C 2009 Nat. Phys. 5 438
- [9] Sobota J A, Yang S L, Kemper A F, Lee J J, Schmitt F T, Li W, Moore R G, Analytis J G, Fisher I R, Kirchmann P S, Devereaux T P, Shen Z X 2013 *Phys. Rev. Lett.* **111** 136802
- [10] Zhang J, Jiang T, Zhou T, Ouyang H, Zhang C X, Xin Z, Wang Z Y, Cheng X a 2018 *Photonics Res.* 6 14
- [11] Jiang T, Miao R, Zhao J, Xu Z, Zhou T, Wei K, You J, Zheng X, Wang Z, Cheng X A 2019 Chin. Opt. Lett. 17 020005
- [12] Liu C, Liu X R 2019 Acta Phys. Sin. 68 175 (in Chinese) [刘 畅, 刘祥瑞 2019 物理学报 68 175]
- [13] Luo Z, Maassen J, Deng Y, Du Y, Garrelts R P, Lundstrom M S, Ye P D, Xu X 2015 Nat. Commun. 6 8572
- [14] Youngblood N, Peng R, Nemilentsau A, Low T, Li M 2016 ACS Photonics 4 8
- [15] Zhou Y, Zhang M, Guo Z, Miao L, Han S-T, Wang Z, Zhang X, Zhang H, Peng Z 2017 Mater. Horiz. 4 997
- [16] Bao Q, Loh K P 2012 ACS Nano 6 3677
- [17] Novoselov K S, Geim A K, Morozov S V, Jiang D, Katsnelson M I, Grigorieva I V, Dubonos S V, Firsov A A 2005 Nature 438 197
- [18] Guo B, Xiao Q L, Wang S H, Zhang H 2019 Laser Photonics Rev. 13 1800327
- [19] Yang Y, Wang X, Liu S C, Li Z, Sun Z, Hu C, Xue D J, Zhang G, Hu J S 2019 Adv. Sci. 6 1801810
- [20] Xia F, Wang H, Jia Y 2014 Nat. Commun. 5 4458
- [21] Zheng J, Yang Z, Si C, Liang Z, Chen X, Cao R, Guo Z, Wang K, Zhang Y, Ji J, Zhang M, Fan D, Zhang H 2017 ACS Photonics 4 1466
- [22] Tan D Z, Lim H E, Wang F, Mohamed N B, Mouri S, Zhang W J, Miyauchi Y H, Ohfuchi M, Matsuda K 2016 Nano Res. 10 546
- [23] Huang D H, Wan M J, Wang F H, Yang J S, Cao Q L, Wang J H 2016 Acta Phys. Sin. 65 063102 (in Chinese) [黄多辉, 万 明杰, 王藩侯, 杨俊升, 曹启龙, 王金花 2016 物理学报 65 063102]
- [24] Zhang C X, Ouyang H, Miao R L, Sui Y Z, Hao H, Tang Y X, You J, Zheng X, Xu Z J, Cheng X A, Jiang T 2019 Adv. Opt. Mater. 7 1900631
- [25] Aslan O B, Chenet D A, van der Zande A M, Hone J C, Heinz T F 2015 ACS Photonics 3 96
- [26] Zhao H, Wu J, Zhong H, Guo Q, Wang X, Xia F, Yang L,

Tan P, Wang H 2015 Nano Res. 8 3651

- [27] Jang H, Ryder C R, Wood J D, Hersam M C, Cahill D G 2017 Adv. Mater. 29 1700650
- [28] Villegas C E P, Rocha A R, Marini A 2016 Phys. Rev. B 94 134306
- [29] Lin Y C, Komsa H P, Yeh C H, Bjorkman T, Liang Z Y, Ho C H, Huang Y S, Chiu P W, Krasheninnikov A V, Suenaga K 2015 ACS Nano 9 11249
- [30] Gomes L C, Trevisanutto P E, Carvalho A, Rodin A S, Castro Neto A H 2016 Phys. Rev. B 94 155428
- [31] Wei Z M, Xia J B 2019 Acta Phys. Sin. 68 48 (in Chinese)
 [魏钟鸣, 夏建白 2019 物理学报 68 48]
- [32] Zhou X, Hu X, Zhou S, Zhang Q, Li H, Zhai T 2017 Adv. Funct. Mater. 27 1703858
- [33] Yang Y, Liu S C, Yang W, Li Z, Wang Y, Wang X, Zhang S, Zhang Y, Long M, Zhang G, Xue D J, Hu J S, Wan L J 2018 J. Am. Chem. Soc. 140 4150
- [34] Yan Y, Xiong W, Li S, Zhao K, Wang X, Su J, Song X, Li X, Zhang S, Yang H, Liu X, Jiang L, Zhai T, Xia C, Li J, Wei Z 2019 Adv. Opt. Mater. 7 1900622
- [35] Cao M, Cheng B, Xiao L, Zhao J, Su X, Xiao Y, Lei S 2015 J. Mater. Chem. C 3 5207
- [36] Ling X, Huang S, Hasdeo E H, Liang L, Parkin W M, Tatsumi Y, Nugraha A R, Puretzky A A, Das P M, Sumpter B G, Geohegan D B, Kong J, Saito R, Drndic M, Meunier V, Dresselhaus M S 2016 Nano Lett. 16 2260
- [37] Yang S, Liu Y, Wu M, Zhao L D, Lin Z, Cheng H C, Wang Y, Jiang C, Wei S-H, Huang L, Huang Y, Duan X 2017 Nano Res. 11 554
- [38] Wu L, Patankar S, Morimoto T, Nair N L, Thewalt E, Little A, Analytis J G, Moore J E, Orenstein J 2016 Nat. Phys. 13 350
- [39] Zhang S, Dong N, McEvoy N, O'Brien M, Winters S, Berner N C, Yim C, Li Y, Zhang X, Chen Z, Zhang L, Duesberg G S, Wang J 2015 ACS Nano 9 7142
- [40] Liu F, Xing Q R, Hu M L, Li Y F, Wang C L, Chai L, Wang Q Y 2011 Acta Phys. Sin. 60 704 (in Chinese) [刘丰, 邢岐荣, 胡明列, 栗岩锋, 王昌雷, 柴路, 王清月 2011 物理学报 60 704]
- [41] Meng X, Zhou Y, Chen K, Roberts R H, Wu W, Lin J F, Chen R T, Xu X, Wang Y 2018 Adv. Opt. Mater. 6 1800137
- [42] Chen H, Wang C, Ouyang H, Song Y, Jiang T 2020 Nanophotonics
- [43] Wang K, Chen Y, Zheng J, Ge Y, Ji J, Song Y, Zhang H 2019 Nanotechnol. **30** 415202
- [44] Song Y, Chen Y, Jiang X, Liang W, Wang K, Liang Z, Ge Y, Zhang F, Wu L, Zheng J, Ji J, Zhang H 2018 Adv. Opt. Mater. 6 1701287

SPECIAL TOPIC—Nonlinear optics and devices of low-dimensional materials

Polarization-dependent nonlinear optical response in GeSe₂^{*}

Ouyang Hao^{1)2)3)#} Hu Si-Yang^{1)#} Shen Man-Ling¹⁾²⁾³⁾ Zhang Chen-Xi¹⁾ Cheng Xiang-Ai¹⁾²⁾³⁾ Jiang Tian^{2)†}

(College of Advanced Interdisciplinary Studies, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)
 (State Key Laboratory of Pulsed Power Laser Technology, Changsha 410073, China)

3) (Hunan Provincial Key Laboratory of High Energy Laser Technology, Changsha 410073, China)

(Received 25 March 2020; revised manuscript received 11 April 2020)

Abstract

Germanium diselenide (GeSe₂), a layered IV-VI semiconductor, has an in-plane anisotropic structure and a wide band gap, exhibiting unique optical, electrical, and thermal properties. In this paper, polarization axis Raman spectrum and linear absorption spectrum are used to characterize the crystal axis orientation and energy band characteristics of GeSe₂ flake, respectively. Based on the results, a micro-domain I scan system is used to study the optical nonlinear absorption mechanism of GeSe₂ near the resonance band. The results show that the nonlinear absorption mechanism in GeSe₂ is a superposition of saturation absorption and excited state absorption, and is strongly dependent on the polarization and wavelength of incident light. Under near-resonance excitation (450 nm), the excited state absorption is more greatly dependent on polarization. With different polarizations of incident light, the modulation depth can be changed from 4.6% to 9.9%; for non-resonant excitation (400 nm), the modulation depth only changes from 7.0% to 9.7%. At the same time, compared with saturation absorption, the polarization-dependent excited state absorption is greatly affected by the distance away from the resonance excitation wavelength.

Keywords: anisotropy, excited state absorption, micro-domain I-scan PACS: 42.65.-k, 42.70.Nq DOI: 10.7498/aps.69.20200443

^{*} Project supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant Nos. 11802339, 11805276, 61805282, 61801498, 11804387, 11902358), the Scientific Researches Foundation of National University of Defense Technology, China (Grant Nos. ZK16-03-59, ZK18-01-03, ZK18-03-36, ZK18-03-22), the Natural Science Foundation of Hunan Province, China (Grant No. 2016JJ1021), the Open Director Fund of State Key Laboratory of Pulsed Power Laser Technology, China (Grant No. SKL2018ZR05), the Open Research Fund of Hunan Provincial Key Laboratory of High Energy Technology, China (Grant No. GNJGJS03), the Opening Foundation of State Key Laboratory of Laser Interaction with Matter, China (Grant No. SKLLIM1702), and the Youth Talent Lifting Project, China (Grant No. 17-JCJQ-QT-004).

 $^{^{\#}\,}$ These authors contributed equally.

[†] Corresponding author. E-mail: tjiang@nudt.edu.cn